SNational Sun Yat-sen University

EXPERIMENT OF MEMS FABRICATION PROCESS 微機電製程實務

製程實驗報告-9

授課教授:潘正堂教授

組別:第8組

姓名:B083022053 黄啟桓

實驗日期:113/5/31

一、實驗參數與操作流程

1. 清潔基材:

清洗基材 (例如矽片)以去除表面的任何污染物,如灰塵、油脂或氧化物。

常用的清潔方法包括超聲波清洗、化學清洗和去離子水漂洗。

2. 塗覆光阻:

在基材表面均勻塗覆一層光阻材料。
使用旋轉塗布機將光阻均勻塗佈在基材上,並進行預烘烤以去除溶劑。

3. 曝光:

通過光罩將紫外光或電子束曝光到光阻上,將需要保留的區域遮罩住。 光阻根據所用的光阻類型(正性或負性),在曝光區域發生化學變化。

4. 顯影:

將基材浸入顯影液中,去除曝光後發生化學變化的光阻。 後續進行漂洗和烘烤,以確保光阻圖案清晰且牢固。

5. 蝕刻:

根據選擇的蝕刻方法 (乾式或濕式), 進行材料的蝕刻。

- 乾式蝕刻:

將基材放入真空腔中,使用等離子體或反應性氣體進行蝕刻。

- 濕式蝕刻:

將基材浸入蝕刻液中,利用化學反應溶解材料。

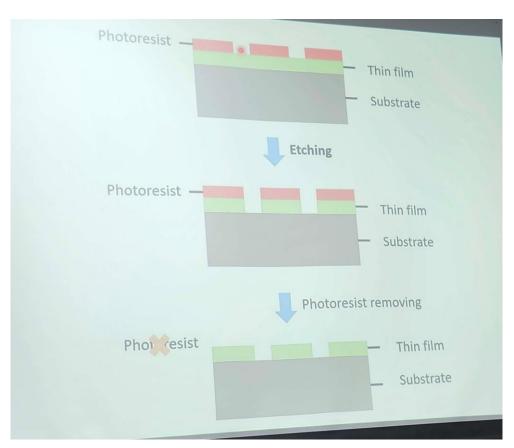
6. 光阻去除:

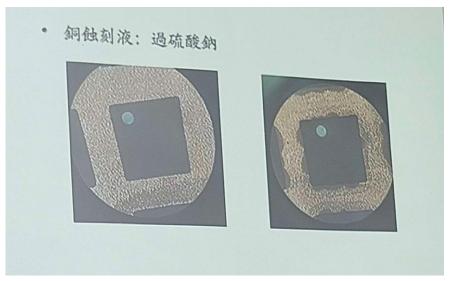
蝕刻完成後,使用適當的化學溶液或等離子體去除剩餘的光阻。

7. 清潔和檢查:

最後,對基材進行清潔,以去除任何殘留的化學物質。 使用顯微鏡或其他檢測設備檢查蝕刻結果,確保達到預期的圖案和精 度。

二、實驗結果





三、實驗心得

乾、濕式蝕刻的實驗,以比較兩者在不同材料上的效果。乾式蝕刻具有較高的方向性,可以進行精細圖案的製作、精確控制蝕刻深度,適合製作微小結構。濕式蝕刻則,雖然設備簡單且成本低,但蝕刻過程中容易產生等向性,導致圖案邊緣不夠清晰。

四、補充資訊與問題討論

1. 乾、濕式蝕刻的差異

性質	乾式蝕刻	濕式蝕刻
均勻性	電漿均勻性最好	
選擇性	低	高
方向性	非等向性	等向性
蝕刻速度	慢	快
成本	高	低

2. 比較 等向性、非等向性 的差異

等向性蝕刻:

定義:蝕刻速度在所有方向上都相同,形成的蝕刻輪廓是均匀的。

特點:蝕刻過程中會均勻地溶解材料,導致垂直和水平方向的蝕刻速度

相同,通常產生圓滑的邊緣。不適合製作高精度的圖案。

非等向性蝕刻:

定義: 蝕刻速度在不同方向上不同,通常在特定方向上有較快的蝕刻速度。

特點:可以控制蝕刻的方向性,垂直蝕刻速度比水平蝕刻速度快,適合 製作精細和高精度的結構。

3. 濕蝕刻的特性

化學溶液溶解。

選擇性高, 蝕刻液依材料而定。

等向性蝕刻,適合3µm 以上的製程。

簡單和低成本。

適用範圍廣。